

INSCRIPCIÓN

Los derechos de inscripción ascienden a:

350 Euros (IVA incluido)

Se incluye además de las charlas teóricas y sesiones prácticas, documentación científica y técnica actualizada sobre el objeto del curso.

Se incluye la comida del medio día.

Modo de pago: transferencia a la Cuenta :

BSCH 0049 1803 52 2410025022

Bruker Española, S.A. CIF A-28315539

** Indicar en la transferencia Curso "La difracción de rayos-X"*

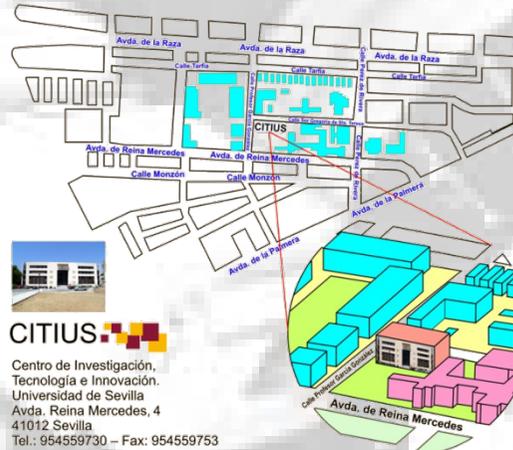
REQUERIMIENTOS:

Para la realización de los ejercicios, los asistentes vendrán provistos de un ordenador portátil con sistema operativo Windows 7.



LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (CITIUS). Universidad de Sevilla.



Horario del curso:

Lunes 17: de 15:00 a 20:00h

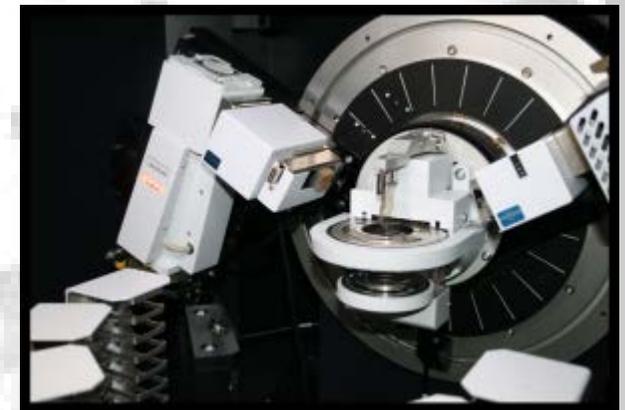
Martes 18: de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 20h

Miércoles 19: de 9:00 a 14:00



La difracción de Rayos X.
Introducción al análisis de difractogramas

Sevilla, 17 al 19 de Octubre de 2011



OBJETIVOS

El principal objetivo del curso es posibilitar que el alumnado adquiera una formación inicial en distintas técnicas instrumentales utilizadas en las medidas de difracción de Rayos X, así como formarlo para la interpretación cualitativa y cuantitativa de los diagramas de difracción. Se introducirá al alumno en el manejo de aplicaciones informáticas incluidas en el soporte Diffrac Suite.

ORGANIZA

BRUKER, con la colaboración del Servicio General de Investigación "Laboratorio de Rayos-X" del CITIUS de la Universidad de Sevilla.

DIRECTORA DEL CURSO

Dra. Patricia Aparicio Fernández

PROFESORADO

Dra. M^a Dolores Alba Carranza. ICMSE-CSIC.

Dra. Patricia Aparicio Fernández.
Universidad de Sevilla

D. Santiago Medina Carrasco.
Universidad de Sevilla

Dra. Esperanza Pavón González.
Universidad de Sevilla

PROGRAMA DEL CURSO

- 1.- Fundamentos de la Difracción de Rayos X. Interacción de la radiación con la materia. Producción de Rayos X. Métodos de difracción de Rayos X. Factores que afectan a la intensidad de los Rayos-X difractados.
- 2.- Estrategias para la adquisición de datos. Medida y evaluación de errores. Procedimientos generales de reducción de datos.
- 3.- Análisis cualitativo de fases cristalinas. Desarrollo de rutinas de evaluación.
- 4.- Manejo y mantenimiento de bases de datos PDF (Power Diffraction File). Manipulación de bases de datos ICCD con formatos PDF2, PDF4 y COD (Crystallography Open Database). Creación y empleo de bases de datos por el usuario.
- 5.- Introducción al análisis cuantitativo de fases cristalinas.
- 6.- Métodos de Regresión. Introducción a la aplicación DQUANT. Interpretación de resultados del análisis cuantitativo.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Curso:

La difracción de Rayos X. Introducción al análisis de difractogramas

Sevilla, 17-19 de Octubre de 2011

Datos:

Compañía o Centro:

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Tfno.:

E-mail:

CIF:

Enviar la solicitud junto con recibo de la transferencia a bruker@bruker.es o por FAX a +34 91 6562237